

1. Record Nr.	BNI0019001
Autore	Tosi, Alberto <1975-
Titolo	Non-invasive testing of VLSI circuits : doctoral dissertation / of Alberto Tosi ; advisor: Franco Zappa ; tutor: Andrea Lacaita ; supervisor of doctoral program: Stefano Crespi Reghizzi
Editore	2005
Descrizione fisica	1 v.
Classificazione	(21)
Materia	621.3
Collocazione	TDR 2005 06853
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Tesi di dottorato
Livello bibliografico	Monografia
Note	In testa al front.: Politecnico di Milano, Dipartimento di elettronica e informazione, dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione